

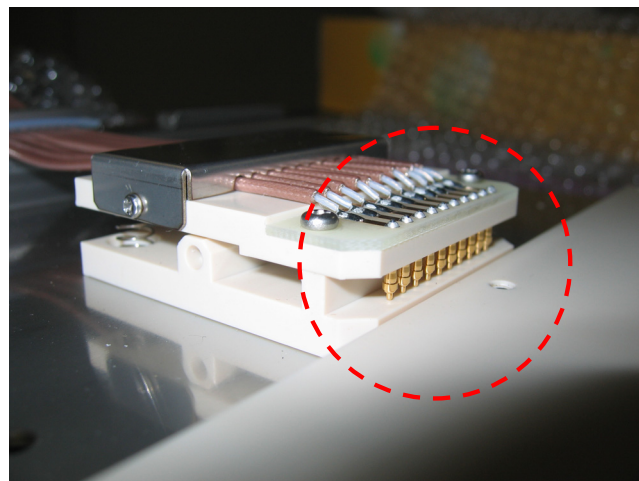
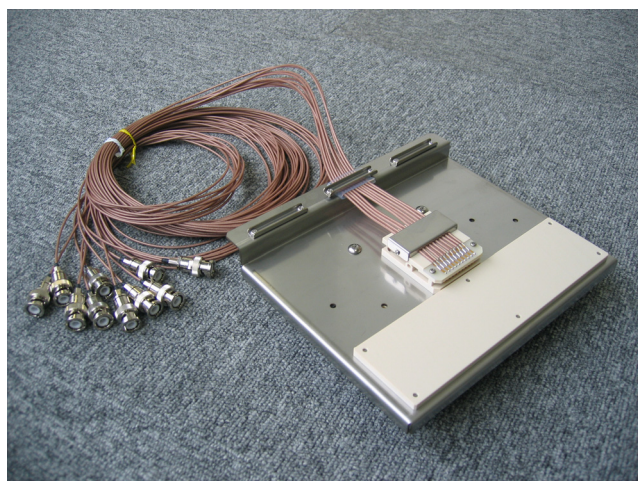
試験コストの削減に貢献する「環境試験治具」 Part1

型式：EPC-JIG

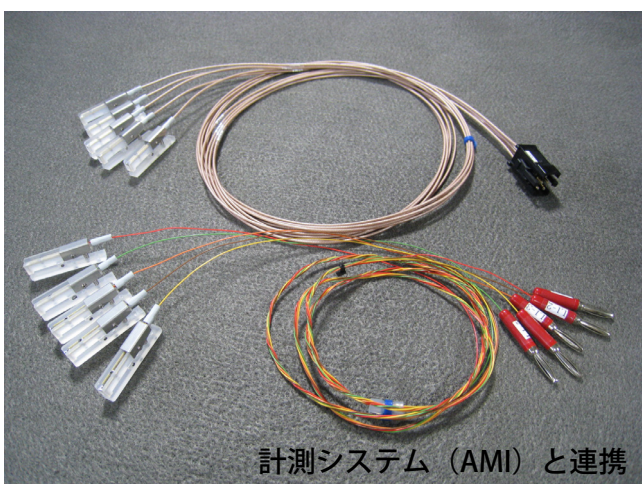
環境試験は環境試験器さえ揃えば、すぐにできるものではありません。試料を望ましい状態に固定したり、電気的なストレス印加や計測を行う場合には、様々な機器との接続を行うなど、付随作業が多々挙げられます。実際に治具を作製するが、その治具が十分なものでなく満足な試験結果を得られなく、費用や時間的損失を生んだことはありませんか？また、そのようなノウハウがないために、手間のかかる作業をあえて行っていないでしょうか？ポイントは信頼性、耐久性、コストです。試験環境をトータルでサポートする環境試験治具についてご紹介していきます。

フィルム状の試料用

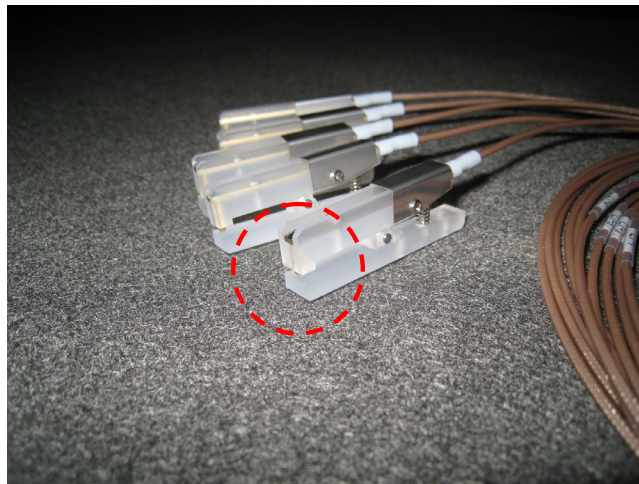
●プローブクリップ治具（一連プローブタイプ）



●プローブクリップ治具（独立プローブ・計測システム連携タイプ）



計測システム（AMI）と連携



FPC（Flexible Printed Circuits）などのフィルム状の形状をした電子部品における絶縁信頼性を評価する際、その電極への測定ケーブルの接続は非常に困難であり場合によっては、はんだ材などを使った接続ができずに試験品質への影響を無視できないことがあります。そのようなとき、写真のようなクリップタイプ治具が最適です。単に電極へのコンタクトを確立するだけでなく、その接続容易性から作業時間を大幅に削減することが可能です。

また、フィルムに限定した用途ではなく一般的なプリント基板やガラス基板などにもご利用頂けます。さらに高温高湿（85℃/85%）だけではなくHASTなどの条件にも対応しています。

チップコンデンサ用

●コンタクトクリップ治具（特許申請中）

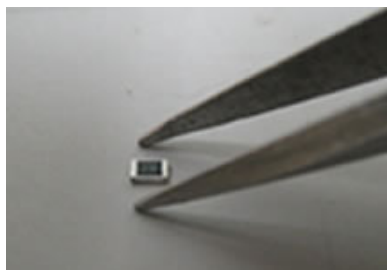


コンタクトクリップの先端が電極兼ピンセットになっています。コンタクトクリップを下向きに持って部品を摘みます。



部品を摘んだコンタクトクリップの向きを上向きに持ち直して槽内に置かれた治具本体のソケットに差し込むとセットが完了します。

●従来型チップコンデンサ用治具



部品をピンセットで摘みます。



コンタクトプローブを引いてピンセットで摘んだ部品を電極間に挟みます。



近年、チップコンデンサへの要求は、小型化、高耐電圧化と採用から、その品質信頼性が重要視されつつあります。そのようなサンプルを試験する際、電極とのコンタクトと試料の固定を行う治具は必須のアイテムになります。今回は治具の一例として、ピンセット機能を一体化したコンタクトクリップタイプと従来型の2つの治具を紹介させていただきます。

仕様

治具名称	項目	仕様値
・プローブクリップタイプ (フィルム状の試料用)	使用温度・湿度範囲	85°C85% または 130°C/85
	耐電圧	1V~1000V
	絶縁保証	1.0×10 ¹³ Ω以上
	測定数	任意（要求数に合わせて設定可能）
	価格	乞うご照会
・コンタクトクリップタイプ ・チップコンデンサ用治具 (チップコンデンサ用)	使用温度・湿度	85°C85% または 130°C/85
	耐電圧	1V~1000V
	絶縁保証	1.0×10 ¹³ Ω以上
	測定数	任意（要求数に合わせて設定可能）
	価格	乞うご照会

エスペック株式会社 <http://www.espec.co.jp/>

本社

530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6

Tel:06-6358-4750 Fax:06-6358-5176

首都圏オフィス

105-0004 東京都港区新橋5-14-10

新橋スクエアビル6F

Tel:03-6402-3597 Fax:03-6402-3593

●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

記載内容は2010年3月現在のものです。